Scanning Electron Microscope

SEM FlexSEM 1000

HITACHI
Inspire the Next

توضیحات دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) FlexSEM 1000

دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope) ساخت شرکت HITACHI ابزار کاملی است که از آن جهت بررسی مورفولوژی و توپولوژی مواد، قطعات بالک، شیشه های لایه نازک و نانو ذرات در مراکز تحقیقاتی و صنعتی استفاده می‌شود. دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope) مدل S-3700N ساخت شرکت HITACHI با منابع الکترون و آشکارساز مناسب قابلیت تصویربرداری عالی و کارایی بالا را دارد. دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope) مدل FlexSEM 1000 ساخت شرکت HITACHI دارای ویژگی های تکنولوژیکی عالی و پیشرفته و تصویربرداری بی نظیر، حتی در محیط های با فشار متغیر است. دستگاه آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل FlexSEM 1000 یک دستگاه مطمئن در هر آزمایشگاهی برای انجام آنالیز است.

دستگاه آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل FlexSEM 1000 دارای ویژگی هایی همچون سیستم‌های تشخیص سیگنال عالی جهت تصویربرداری بی نظیر است. دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل FlexSEM 1000 با سیستم انرژی پاک به عنوان یک ابزار آنالاتیکال اقتصادی بدون افت عملکرد است. دستگاه آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل FlexSEM 1000 دستگاهی شگفت انگیز بوده و نظر همگان را در مورد میکروسکوپ الکترونی تغییر خواهد داد.

دستگاه آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل FlexSEM 1000 دارای سیستم تشخیص نوری و سیگنال های الکترونیکی است که تصویربرداری بی نظیر و تحلیل نتایج عالی را برای کاربردهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی فراهم می کند. دستگاه آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل FlexSEM 1000

آدرس : یوسف آباد، خیابان بیستون، نبش کوچه ۱/۲، پلاک ۶۲، ساختمان
شماره تماس: ۰۹۱۲۰۳۹۳۱۷۷
ایمیل: info@zahora.ir

دارای یک طراحی جمع و جور، قابل اتصال به تجهیزات جانبی جهت انجام سایر آنالیزها، قابل نصب و بکارگیری در ادارات و دفاتر کوچک و عدم حساسیت به تشعشعات تلفن همراه را داراست.

تمامی این ویژگی ها به همراه خدمات دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل FlexSEM 1000 که به واسطه ی شرکت HITACHI در سراسر دنیا انجام می گیرد، خرید دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل FlexSEM 1000 ، از این شرکت را به گزینه ای بی رقیب تبدیل کرده است. برای اطلاع از قیمت دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل FlexSEM 1000 با شماره درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

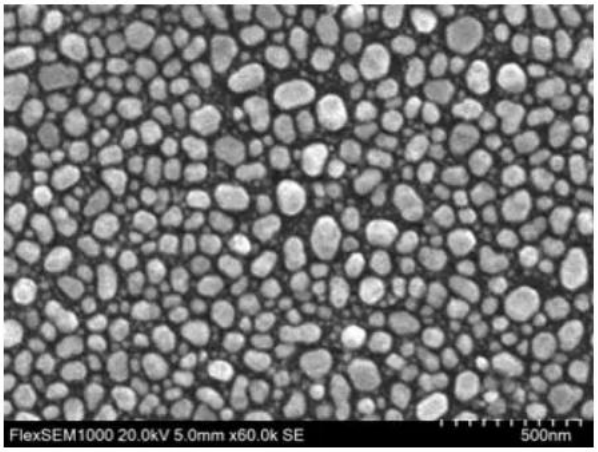
ویژگی های دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) FlexSEM 1000

ستون کارایی بالا و فشرده

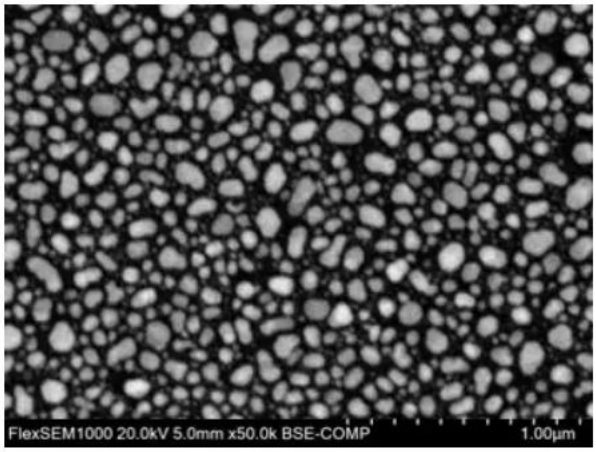
دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل FlexSEM 1000 دارای رزولوشن بالا در سیستم فشرده با یک طراحی الکتریکی جدید به همراه یک حسگر با حساسیت قابل اطمینان است. دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل FlexSEM 1000 تصاویر تا اندازه ۴ نانومتر را ساپورت می کند.

کیفیت تصویر بی نظیر با وضوح عالی

آدرس : یوسف آباد، خیابان بیستون، نبش کوچه ۱/۲، پلاک ۶۲، ساختمان
شماره تماس: ۰۹۱۲۰۳۹۳۱۷۷
ایمیل: info@zahora.ir



Accelerating Voltage: 20 kV
Secondary Electron (SE) Image
Magnification: 60,000X
Resolution: 4.0 nm



Accelerating Voltage: 20 kV
Backscattered Electron (BSE) Image
Magnification: 50,000X
Resolution: 5.0 nm

رابط کاربری ساده و تصویر برداری سریع و اتوماتیک

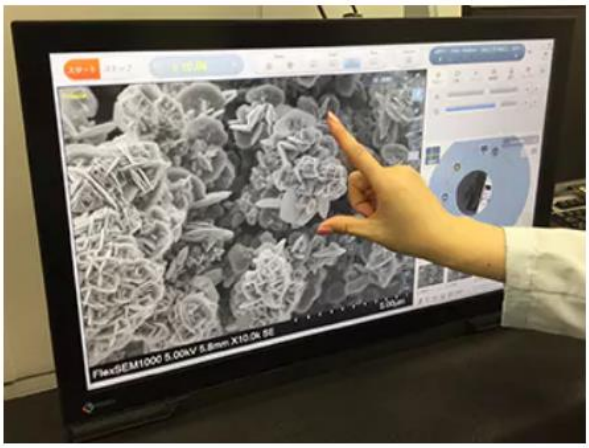
دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) FlexSEM 1000 قابلیت ثبت و عملکرد بهینه سازی تصاویر به صورت اتوماتیک با تراکم پیکسل بالا، تصاویر زمان واقعی وتصاویر کامل بوده و دارای رابط کاربری ساده و طراحی گرافیکی عالتصی است.

دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) FlexSEM 1000 قابلیت نمایش تصاویر از دو آشکارساز را همزمان دارد.

آشکارساز فشار فوق متغیر

آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل FlexSEM 1000 قابلیت ثبت تصاویر در ولتاژهای کم و خلا پایین را نیز دارا ست و برای نمونه های نارسانا بدون نیاز به پوشش هادی (فلزی) بسیار مناسب است.

آدرس : یوسف آباد، خیابان بیستون، نبش کوچه ۱/۲، پلاک ۶۲، ساختمان
شماره تماس: ۰۹۱۲۰۳۹۳۱۷۷
ایمیل: info@zahora.ir



کاربردهای دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) FlexSEM 1000

۱. بررسی نمونه‌هایی که برای متالوگرافی آماده شده‌اند، در بزرگنمایی بسیار بیشتر از میکروسکوپ نوری

۲. بررسی مقاطع شکست و سطوحی که حکاکی عمیق شده‌اند، که مستلزم عمق میدانی بسیار بزرگتر از حد میکروسکوپ نوری است .

۳. ارزیابی جهت کریستالوگرافی اجرایی نظیر دانه‌ها، فازهای رسوبی و دندریت‌ها بر روی سطوح آماده‌شده برای کریستالوگرافی

آدرس : یوسف آباد، خیابان بیستون، نبش کوچه ۱/۲، پلاک ۶۲، ساختمان
شماره تماس: ۰۹۱۲۰۳۹۳۱۷۷
ایمیل: info@zahora.ir

۴. شناسایی مشخصات شیمیایی اجزایی به کوچکی چندمیکرون روی سطح نمونه‌ها، برای مثال، آخال‌ها، فازهای رسوبی و پلیسه‌های سایش

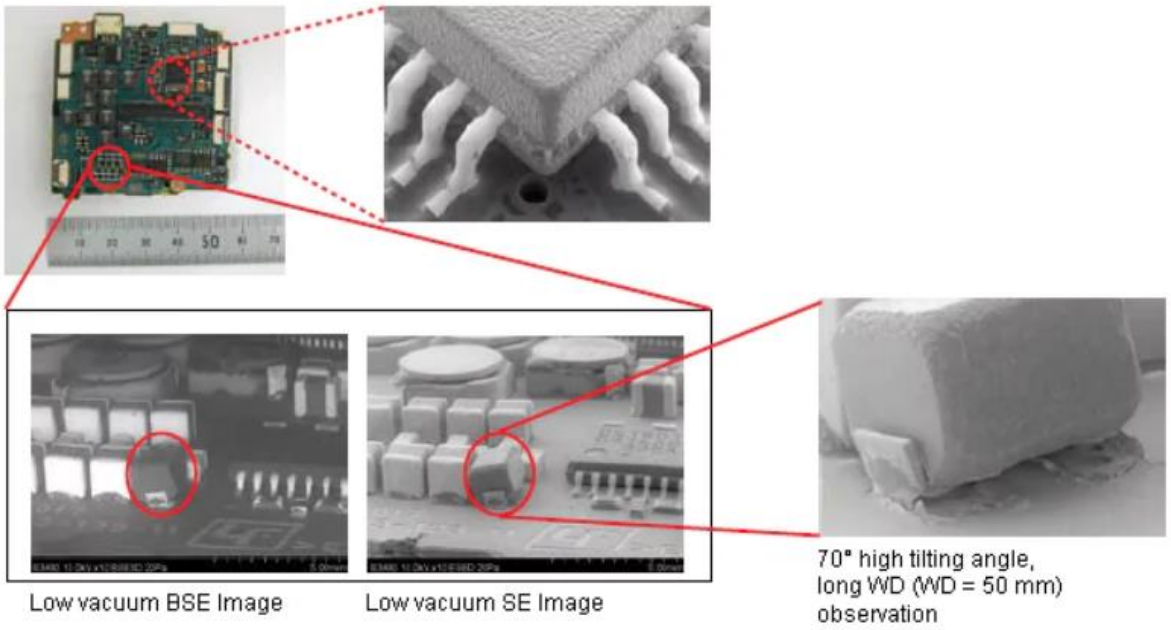
۵. ارزیابی گرادیان ترکیب شیمیایی روی سطح نمونه‌ها در فاصله‌ای به کوچکی 1µm

بررسی قطعات نیمه‌هادی برای آنالیز شکست، کنترل عملکرد و تأیید طراحی

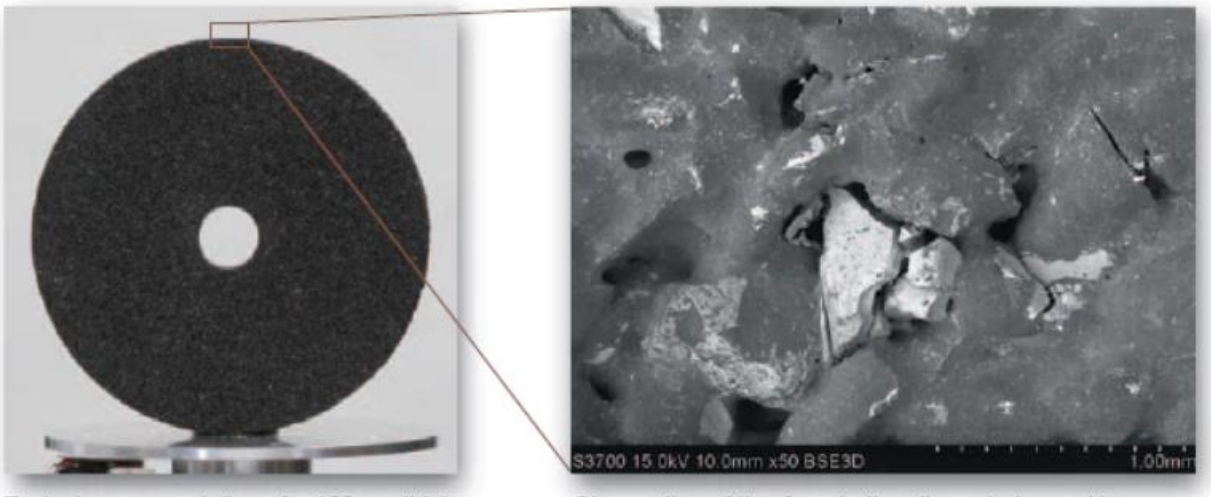
نمونه هایی از کاربردهای دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) FlexSEM 1000

نیمه هادی ها

آدرس : یوسف آباد، خیابان بیستون، نبش کوچه ۱/۲، پلاک ۶۲، ساختمان
شماره تماس: ۰۹۱۲۰۳۹۳۱۷۷
ایمیل: info@zahora.ir



Sample: IC on a printed circuit board

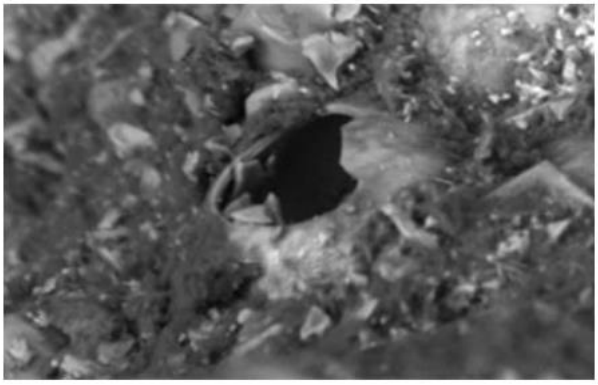


Typical accommodation of a 100mm thick sample (a grinding disc)

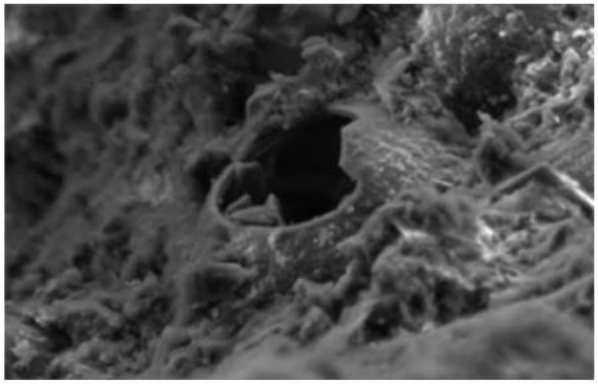
Observation of tip of a grinding disc set at a working distance of 10mm for EDX work

Sample: Grinding disc

آدرس : یوسف آباد، خیابان بیستون، نبش کوچه ۱/۲، پلاک ۶۲، ساختمان
شماره تماس: ۰۹۱۲۰۳۹۳۱۷۷
ایمیل: info@zahora.ir

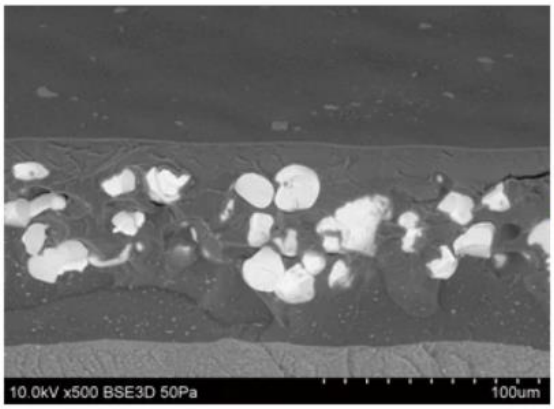


BSE Image



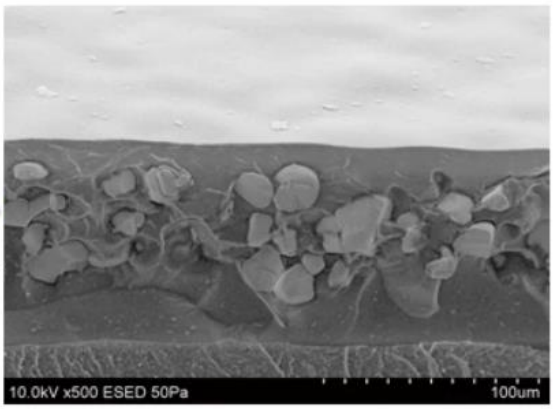
Low Vacuum SE image

Sample: Glass and Fiber Composite



BSE image

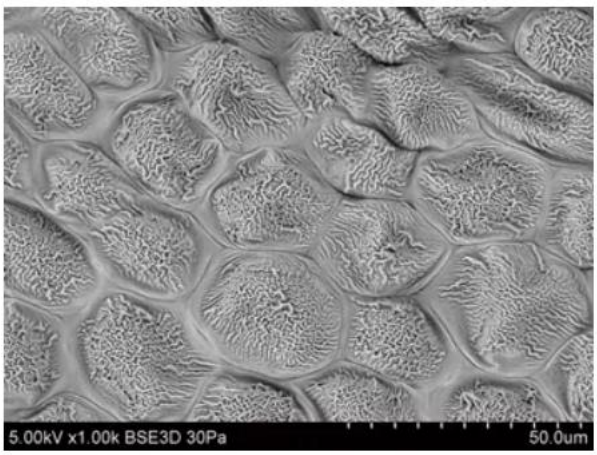
The same field of view



Low Vacuum SE image

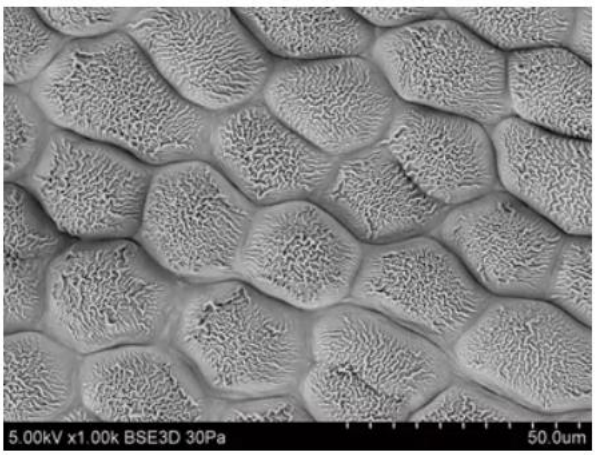
Sample: LLP(Long-lasting Phosphor)

At an ambient temperature



Sample shrinkage is seen after 10 minutes.

At -20°C (A cooling stage was used.)



Sample shrinkage is not seen after 10 minutes.

Sample: Plum petal

آدرس : یوسف آباد، خیابان بیستون، نبش کوچه ۱/۲، پلاک ۶۲، ساختمان
شماره تماس: ۰۹۱۲۰۳۹۳۱۷۷
ایمیل: info@zahora.ir